

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18 – 19 мая 2021 г. г. МОСКВА** | | |
| **Современное аналитическое оборудование**  **для химического и структурного анализа**  **производства компаний «Bruker» и «Analytik Jena».**  **Промышленные компьютерные томографы производства компании «NSI».** | | |
| **Контактные данные\*** |  |  |
| Предприятие |  | |
| Должность, степень |  | |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество |  | |
| Почтовый адрес (организации) |  | |
| Индекс / город / улица / дом | |
| Контактные телефоны |  | |
| Рабочий / мобильный | |
| Электронная почта |  | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Какое оборудование Вас интересует?** | | | | | | |
|  | Портативные спектрометры | | | | | |
|  | Рентгенофлуоресцентные спектрометры | | | | | |
|  | Спектрометры для элементного микроанализа | | | | | |
|  | Рентгеновские дифрактометры | | | | | |
|  | Оптико-эмиссионные спектрометры | | | | | |
|  | Анализаторы газов | | | | | |
|  | ИК-Фурье и Раман спектрометры | | | | | |
|  | Промышленные компьютерные томографы | | | | | |
|  | Лекция Демонстрация | | | | | |
| Какие дни семинара планируете посетить\* | |  |  |  |  | 18 мая |
|  |  |  | 19 мая |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| Просим направить регистрационную форму до 14 мая 2021 по:  факсу: +7 (495) 781-07-85, e-mail: [marketing@melytec.ru](mailto:marketing@melytec.ru)  Участие в семинаре бесплатное. Регистрация каждого участника обязательна.  Количество участников ограничено – 1 участник от предприятия (или подразделения). |
| **\*Отправляя заполненную регистрационную форму,**  **вы даете свое согласие на обработку персональных данных.** |

|  |
| --- |
| **18 – 19 мая 2021 г. г. МОСКВА**  **Требования к образцам для участия в мастер-классе** |
|  |

**для анализа на рентгеновском дифрактометре D2 PHASER:**

1. Порошковые образцы - помол 5-30 микрон. Объем 0,01-2 см3.
2. Монолитные образцы - толщиной не более 5 мм, диаметр не более 30 мм, с плоской поверхностью, исключающей высокую шероховатость (6 класс и выше), раковины, трещины и другие повреждения

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры):*

|  |
| --- |
|  |
|  |

**для анализа на рентгенофлуоресцентном спектрометре S2 PUMA:**

1. Порошковые образцы - помол 1-100 микрон. Объем не менее 1 см3.
2. Монолитные образцы - толщиной не более 10 мм, диаметр не более 30 мм, с плоской поверхностью, исключающей высокую шероховатость (6 класс и выше), раковины, трещины и другие повреждения

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры*):

|  |
| --- |
|  |

**для анализа на рентгенофлуоресцентном спектрометре S1 TITAN:**

1. Порошковые образцы - помол 1-100 микрон. Объем не менее 1 см3.
2. Монолитные образцы - диаметр не менее 15 мм, с плоской поверхностью, исключающей высокую шероховатость (6 класс и выше), раковины, трещины и другие повреждения

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры*):

|  |
| --- |
|  |

**для анализа на оптико-эмиссионном спектрометре Q4 TASMAN:**

1. Образец стали или сплава диаметром более 16 мм с плоской поверхностью, исключающей окалину, раковины, трещины и другие повреждения, толщина - от 1 мм.

|  |
| --- |
| *Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры):* |
|  |
|  |

**для анализа на микро-рентгенофлуоресцентном спектрометре M1 MISTRAL:**

1. Образцы размером до 100x100x100 мм3
2. Плоский образец покрытия на металлической подложке, количество слоев/покрытий – не более 3х,

материал основы и покрытий – металлы.

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры):*

|  |
| --- |
|  |

**для анализа на анализаторе серы и углерода G4 ICARUS:**

1. Образцы стали или сплавов в виде стружки или мелких кусочков (минимум 5 грамм стружки или кусочков на один образец).
2. Порошковые образцы, не содержащие галогенов - помол 1-100 микрон (минимум 5 грамм на один образец).

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры):*

|  |
| --- |
|  |

**для анализа на анализаторе газов (O, H) в металлах G6 Leonardo:**

1. Образцы стали или сплавов в виде мелких кусочков (параллелепипедов, цилиндров) массой 0,5 – 1 грамм. Поверхность образца должна быть без оксидных пленок и ржавчины. Рекомендуется обработка поверхности образца механически - надфилем или химически – травлением с последующей промывкой в ацетоне или изопропиловом спирте.

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры):*

|  |
| --- |
|  |

**для анализа на ИК-Фурье спектрометра Alpha, микроскопа LUMOS**

1. Образцы органических соединений в виде пластинок, пленок, эмульсий, порошков, жидкостей (безводных).

*Краткая информация о Ваших образцах (материал, форма, размеры):*

|  |
| --- |
|  |

Количество образцов для анализа

в рамках демонстрации на одном приборе – не более 1-го.

**Форму направьте:** [**marketing@melytec.ru**](mailto:marketing@melytec.ru) **| по факсу: + 7(495) 781-07-85**